

「計測分析に関する講演会」

元素分析の基礎

—異物分析や品質管理での活用を目指して—

主催：愛知県、公益財団法人科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センターでは種々の分析機器を用いた分析、評価により、企業の方々の新技術や新製品開発、ものづくりの現場で発生する様々な課題の解決を支援しています。

共同研究支援部（場所：豊田市）では、企業の皆様の異物分析や品質管理に活用できる、微小部蛍光 X 線分析装置、走査電子顕微鏡、X 線光電子分光装置などの元素分析機器を運用しております。企業の皆様の異物分析や品質管理などにお役立ていただくことを目指して、これらの活用事例を中心とした講演会を開催します。また、分析などでご相談されたい案件がございましたら、個別相談会にて、当部職員が対応します。参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

◆日時◆

2023年7月11日（火）13:00～17:10
（受付開始：12:30～）

◆会場◆

あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室
（豊田市八草町秋合 1267-1）

◆定員◆

80名（申込先着順）

時間	内容
13:00 ～ 13:10	開会挨拶 あいち産業科学技術総合センター 所長 中川 幸臣
13:10 ～ 14:10	「微小部蛍光 X 線の原理と最新技術のご紹介」 講師：ブルカージャパン株式会社 ナノ分析事業部 水平 学 氏
14:10 ～ 14:20	休憩
14:20 ～ 15:20	「SEM-EDS 分析入門」 講師：株式会社日立ハイテク 中部支店 解析システム部 二村 和孝 氏 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 分析機器事業部 阿江 啓 氏
15:20 ～ 15:30	休憩
15:30 ～ 16:30	「表面分析法の基礎と応用 XPS と TOF-SIMS を中心に」 講師：アルバック・ファイ株式会社 製品企画室 星 孝弘 氏
16:30 ～ 16:40	「共同研究支援部における元素分析機器の活用について」 あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 杉本 貴紀
16:40 ～ 17:10	個別相談会（希望者のみ）

◆申込方法◆

以下の、いずれかの方法でお申込ください。

■Web ページからお申込みの場合

<https://www.aichi-inst.jp/acist/other/seminar/>

上記 URL 又は二次元コードより、当講演会の欄の「申込」から「講演会・研修会等参加申込みフォーム」に下記必要事項を御記入の上、お申込みください。お申込み後、自動返信メールにて、講演会・講習会等申込み確認メールが届きます。

講演会・研修会名：計測分析に関する講演会

受講予定日：2023.7.11

備考欄：個別相談の希望の有無



■メールでお申込みの場合

件名に「計測分析に関する講演会 7/11 参加申込」と入力し、企業名、所在地、所属、氏名、電話番号、メールアドレス、個別相談の希望の有無をご記入の上、

seminar@chinokyoten.pref.aichi.jp

までお申込みください。お申込み後、申込み確認メールを送信します。

※お申込時点で定員に達していた場合は、早急にお断りの連絡をします。

◆申込期限◆

2023年7月7日（金）17:00

※ただし、定員になり次第締め切ります。

◆参加費◆

無料

◆対象者◆

品質管理や製品開発に携わる企業の方々をはじめ、どなたでも自由に参加できます。

◆交通のご案内◆

- ・東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車すぐ
- ・猿投グリーンロード八草 IC から西へ 800m

◆申込先及び問合せ先◆

あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 計測分析室 杉本、内田、中尾
〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1
電話：0561-76-8315
メール：seminar@chinokyoten.pref.aichi.jp

あいち産業科学技術総合センター 本部

